سنتز و مشخصه یابی نانوسیمهای نقره بعنوان ماده الکترودی شفاف و منعطف برای کاربرد در سلولهای خورشیدی پلیمری

زهرا تیموری، لیلا ناجی*، شعله کاظمی فرد تهران- دانشگاه صنعتی امیرکبیر- گروه مستقل شیمی

تاریخ دریافت: ۹۴/۱۱/۰۴ تاریخ تصحیح:۹۵/۰۲/۲۵ تاریخ پذیرش: ۹۵/۰۳/۰۸

چکیدہ

امروزه کاربرد الکترودهای رسانای شفاف و منعطف نانوسیمهای نقره (AgNWs) به عنوان جایگزینی برای الکترودهای ایندیوم قلع اکساید (TD) در سلول های خورشیدی پلیمری، به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه سنتز و روش های کنترل ابعاد WARها بررسی شده است. ابتـدا AgNW ما به روش پلی اُل سنتز شدند. اثر حضور دانه سدیم کلراید به عنوان یک فاکتور کلیدی در تشکیل AgNWها مورد ارزیابی قرارگرفت و هم چنین اثر نسبت پلیمر پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به پیش مادهی نقره به عنوان عامل کنترل کنندهی ابعاد WAgNها مورد ارزیابی قرارگرفت و هم ها و مورفولوژی آن ها به ترتیب، توسط روش های طیف سنجی فرابنفش- مرئی (V-VI) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) نشان داده شـده است. نتایچ نشان می دهد در نسبت های پلیین PVP/AgNO3 با توسیمهایی با قطر کم تر و طول بیشتر بدست می-آیند. به منظور تهیهی الکترودهای رسانای شفاف و منعطف MagNه محلول WAgNO3 برروی بستر منعطف پلی اتیلن ترفتالات (PET) با روش لایه نشانی چرخشـی لا یه نشانی شده مقاومت سطحی و درصد عبور نور از الکترودهای طراحی شده با توجه به تغییرات حجم محلول لایه نشانی شده، به ترتیب با استفاده از مقاومت سنج و مقاومت سطحی و درصد عبور نور از الکترودهای طراحی شده با توجه به تغییرات حجم محلول لایه نشانی شده، به ترتیب با استفاده از مقاومت سنج و دستگاه طیف سنجی VU-VIS در طول موج ۵۵۰ نانومتر اندازه گیری شد. بهترین الکترود از نمونه با نام 2.5-8. به عنوان جایگزین الکترود را ابا درصد عبور نور از الکترودهای طراحی شده با توجه به تغییرات حجم محلول لایه نشانی شده، به ترتیب با استفاده از مقاومت سنج و به عنوان جایگزین الکترود را با درصد عبور نور از ۲/۶۰ بانومتر اندازه گیری شد. بهترین الکترود از نمونه با نام 2.5-8. به عنوان جایگزین الکترود را با درصد عبور نور از ۲/۶۰ با و مقاومت سطحی ۲/۵۷ اهم بر سانتیمتر مربع بدست آمد.

واژگان كليدى: نانوسيم نقره، سلول خورشيدى پليمرى، پلى وينيل پيروليدون، پلى اتيلن ترفتالات، الكترود منعطف

۱-مقدمه

در سالهای اخیر محققین و شرکتهای صنعتی، تحقیقاتی را با هدف دستیابی به سلولهای خورشیدی کارامد، بادوام و ارزان قیمت که بتوانند وارد بازار فوتوولتاییک گردند، شروع کرده اند[۲–۱]. دراین میان سلولهای خورشید آلی به ویژه پلیمری از نظر هزینه پایین، فراوری راحت، روش ساخت سریع، انعطاف پذیری بالا و سازگاری با محیط زیست، تکنولوژی بی نظیری میباشند[۳]. سلولهای خورشیدی پلیمری انعطاف پذیر به علت کاربردهای جذاب برای استفاده در صفحات خورشیدی، پنجرهها، البسه و بسیاری از کاربردهای دیگر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند [۴]. درمیان فاکتورهای کلیدی برای سلولهای خورشیدی پلیمری، آند نقش مهمی را در عملکرد این سلولها ایفا میکند [۵]. بیشترین موادی که به عنوان آند استفاده میگردند اکسیدهای فلزی شامل آلومینیوم روی اکساید (AZO)، فلوئور قلع اکساید (FTO) و ایندیم قلع اکساید (ITO) میباشند که در میان این مواد، رایج ترین ماده مورد استفاده، TOD میباشد [۶].

[.] *.**نویسنده مسئوول:** استادیار گروه مستقل شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ترکیب ITO معمولا با استفاده از روشهای لایه نشانی بخار فیزیکی [7] (PVD) رسوب شیمیایی بخار [۸] (CVD) ، اسپری پیرولیز [۹] و کندویاش [۱۰] در دماهای بالای ۳۵۰–۲۰۰ درجه سانتیگراد لایه نشانی میگردد. فیلمهای حاصل دارای درصد عبور نور بالای ۹۰ درصد و مقاومت سطحی پایین تر از ۳۰ اهم بر سانتیمترمربع میباشند. این خواص به طور کامل ویژگیهای مورد نیاز برای یک الکترود بمنظور کاربرد در سلول خورشیدی پلیمری را برآورده می کند؛ اما در دماهای پایین تر از ۱۵۰ درجه سانتیگراد کاهش در شفافیت، هدایت الکتریکی و پایداری شیمیایی گزارش شده است. از آنجا که بیشتر زیرلایههای انعطاف پذیر فرایندهای دمای پایین را می توانند تحمل کنند، ITO معمولا مستقیما برروی شیشه لایه نشانی می شود [۱۱]. به علاوه ITO یک ماده سرامیکی بوده، بسیار شکننده و مستعد ترک خوردگی میباشد، بنابراین برای استفاده در دستگاههای انعطافپذیر کاربردهای محدودی دارد. همچنین به دلیل کمبود قلع و افزایش قیمت آن، مصرف انرژی بالا در طی فرایند سنتز و لایه نشانی، مطالعاتی به دنبال جایگزین کردن این ماده با مواد دیگر در سراسر دنیا در حال انجام میباشد [10-14]. مواد جایگزین باید دارای ویژگیهای مطلوب و مهمی از قبیل شفافیت، هدایت الکتریکی، پایداری مکانیکی، انعطاف پذیری بالا و مقاومت سطحی پایین باشند[۱۷-۱۶]. مطالعات بسیاری در رابطه با بکارگیری مواد جایگزین مانند پلی(۳،۴-اتيلن دي اكسي تيوفن) پلي استايرن سولفونات [١٨] (PEDOT:PSS) گرافن [١٩،۵]، نانولولههاي كربني [٢٠] و صفحات مشبک نقره [۲۲–۲۱] صورت گرفته است. بسیاری از این مواد جایگزین مشکلاتی از قبیل هدایت الکتریکی و شفافیت پایین، ناپایداری، روش ساخت مشکل و دستیابی دشوار را به همراه داشتهاند [۲۳]. اخیرا نانوسیم¬های نقره به علت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا، شفافیت نوری و پایداری مکانیکی بالا، به عنوان جایگزین مناسب و قابل رقابت با ITO در نظر گرفته شدهاند [۲۸-۲۸]. نانوسیمهای نقره به عنوان ساختارهای تک بعدی در ابعاد نانو در نظر گرفته می شوند که دارای قطر کمتر از ۱۰۰ نانومتر و طولی معادل یک میکرومتر یا بیشتر میباشند [۳۰–۲۹]. برای تهیهAgNW ، روشهای بسیاری وجود دارد. به طور کلی این روشها را می توان به دو دسته فیزیکی و شیمیایی تقسیم بندی نمود. روشهای فیزیکی شامل روشهای لیتوگرافی [۳۱]، قالبی [۳۲] و روشهای فاز بخار [۳۳] میباشند؛ سنتز AgNW با استفاده از این روشها، فرایند پیچیدهای است که افزایش مصرف انرژی و زمان سنتز نانوسیمها را در پی دارد. از روشهای شیمیایی برای سنتز نانوسیمها، میتوان به روشهای فاز محلول از جمله روشهای حلالی-حرارتی (سولوترمال) [۳۴]، آبی-حرارتی (هیدروترمال) [۳۵] و روش پلی أل [۳۶] اشاره نمود. در سالهای اخیر درمیان فرایندهای فاز محلول، روش پلی اُل به دلیل هزینه کم، سادگی روش و تولید AgNW ها با بازده بالا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این روش برای اولین بار توسط فیوت و همکارانش مطرح گردید[۳۷]. ضیا و همکارانش این روش را برای سنتزAgNW ها با سایز کنترل شده گسترش دادند [۳۸]. در روش پلی اُل انتخاب حلال مناسب [۴۱-۳۹]، عامل کاهنده [۴۰]، عامل پوشاننده سطح نقره [۳۸] و همچنین منبع تامین کننده یون نقره در طی فرآیند سنتز [۴۲] بسیار حائز اهمیت میباشد. مکانیزم کلی واکنش سنتز نانوسیمهای نقره به این صورت میباشد که در ابتدای واکنش یونهای نقره

774

توسط عامل کاهنده به نقره فلزی کاهش می یابند. نانوذرات نقره به هم می پیوندند و نانو ساختارهای نقره را تشکیل می دهند. بر هم کنش عامل پوشانندهی پلیمری با ذرات چند قلو (جفت چندتایی (MTP) (از میان نانوساختارهای نقره تشکیل شده، سبب رشد این ذرات به صورت نانوسیم می گردد. با استفاده از این روش می توان با کنترل و تغییر پارامترهای مؤثر، AgNWبا خلوص، راندمان و نسبت ابعادی متنوع در مدت زمان واکنش کوتاه تر تولید نمود [۴۳]. تاکنون مطالعات بسیاری در زمینه استفاده از عامل پوشاننده پلیمری برای کنترل سرعت رشد ساختارهای نقره در فاز محلول صورت پذیرفته است [۴۴]. مشخص شده است که از لحاظ سینتیکی عامل پوشانندهی پلیمری، سرعت رشد وجوه مختلف یک فلز را از طریق جذب و واجذب گزینشی این وجوه، کنترل می کند. به نظر می رسد که این اثر به علت برهم کنش گزینشی وجوه فلز با گروههای عاملی عامل پوشاننده باشد [۴۸–۴۵]. یکی دیگر از مهم ترین مطالعات انجام شده در راستای بهبود روش پلی اُل، استفاده از دانه در محیط واکنش میباشد که روشی ساده و مؤثر در جهت تولید مقدار انبوه AgNW و تسهیل در تشکیل آنها میباشد [۴۹]. تاکنون اثرات اضافه کردن مقدار بسیار کمی از ترکیباتی مانند2KBr ،CuCl ، Fe(NO3) و KCl بعنوان دانه بر روی نسبت ابعادی و مورفولوژی نانوسیمهای نقره گزارش شده است[۵۳–۵۰]. این ترکیبات در محیط واکنش با نقره واکنش داده و رسوبات نقره با انحلال پذیریهای مختلفی تشکیل میدهند. از آنجا که ثابت انحلال پذیری رسوبات نقره تشکیل شده حاصل در دمای واکنش باهم متفاوت است یونهای نقره با سرعتهای مختلفی وارد محیط واکنش میشوند. تغییر در سینتیک آزاد شدن یونهای نقره، سبب تشکیل هستههای اولیه نقره با ساختارهای متفاوت می گردد. از میان هستههای نقره مانند تک كريستال، جفت شده منفرد و ذراتMTP ، تنهاMTP ها به صورت نانوسيم رشد ميكنند [۵۵–۵۳]. با توجه به مطالعات انجام شده از میان ترکیبات نمکی، ترکیبات کلرینه به علت تشکیل رسوب AgCl با ثابت انحلال پذیری مناسب جهت تشکیل ذرات MTPبهترین عامل کنترل کنندهی سینتیک واکنش محسوب میشوند. وجود همزمان کاتیون و آنیون نقش مؤثری در تولید نانوسیمها دارد [۵۶–۵۵]. اثر پارامترهای مختلف دیگر نیز می تواند در سنتز نانوسیمها بررسی گردد که در مقالات به آنها اشاره شده است [۵۶، ۵۲].

در این مقاله اثر حضور دانه NaCl در سنتز AgNW به روش پلی اُل بررسی شده است. از آنجا که مقدار PVP یک فاکتور کلیدی و مؤثر در کنترل ابعاد AgNW به حساب می آید، اثر نسبت PVP/AgNO₃ بر روی قطر و طول AgNW بررسی شد. مشخصههای نانوسیمهای نقره سنتز شده، با استفاده از تکنیکهای اسپکتروفوتومتری، پراش اشعه ایکس و میکروسکوب الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مقاله هدف از سنتز AgNWها، تهیه ی الکترود آند به عنوان جایگزین ITO در سلولهای خورشیدی پلیمری بوده است. بنابراین، بعد از مرحله ی سنتز، با لایه نشانی AgNW بر روی بستر منعطف پلی اتیلن ترفتالات (PET)، با استفاده از روش لایه نشانی چرخشی، الکترودهای رسانای شفاف و منعطف تهیه شدند. تغییرات درصد عبور نور و مقاومت سطحی الکترودها بر حسب حجم محلول نانوسیم نقره لایه نشانی شده و همچنین نسبت ابعادی نانوسیمهای حاصل بررسی گشتند. مشخص شد خواص نوری و الکتریکی AgNWها به شدت وابسته به نسبت ابعاد آنها میباشد.

۲-بخش تجربی

۲-۱-مواد شیمیایی و معرفهای مورد استفاده

نیترات نقره (AgNO₃) و اتیلن گلایکول (EG) باخلوص ۹۹/۹٪ از شرکت شیمیایی Alfa Aesar خریداری شد. پلیمر پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به صورت پودر با وزن مولکولی ۴۰۰۰۰ از شرکت Alfa Aesar فراهم شد. اتانول ۹۶ درصد از شرکت نور زکریای رازی و استون دکتر مجللی برای شستشو مورد استفاده قرار گرفتند. سدیم کلراید با خلوص ۹۹/۹٪ از شرکت شیمیایی مرک آلمان تهیه شد. جهت تهیه الکترود منعطف، زیرلایه PET با ضخامت ۱۷۵۵ از شرکت از شرکت Teijin Films Teijin Films

۲-۲- تهیه ی AgNWها

نانوسیمهای نقره با استفاده از روش پلی اُل سنتز شدند. در این روش EG به عنوان حلال مواد واکنش دهنده و هم چنین عامل کاهنده یونهای نقره به نقره فلزی، نیترات نقره (AgNO₃) به عنوان تامین کننده یونهای نقره، PVP به عنوان عامل پوشاننده وجوه نقره به منظور کنترل مورفولوژی و ابعاد AgNW، نمک NaCl به عنوان دانه به منظور عامل کنترل کنندهی سینتیک واکنش به کار گرفته شدهاند. اثر حضور و عدم حضور نمک NaCl به عنوان دانه و همچنین اثر بکارگیری غلظتهای متفاوت از پلیمر PVP بر مورفولوژی و ساختار AgNW بررسی گردید. روش انجام آزمایشها تحت عناوین اثر دانه سدیم کلراید

۲-۲-۱ اثر دانه سدیم کلراید

برای تهیه نمونه در غیاب دانه NaCl ، در ابتدا ۵/۰ گرم از پلیمر PVP به ظرف حاوی IN ۱۱ از EG اضافه شد، پس از رسیدن محلول به دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد، در حالی که محلول توسط همزن مغناطیسی با سرعت چرخش ۱۰۰۰ دور بر دقیقه هم می خورد؛ ۵ میلی لیتر از محلول ۱/۱۲ مولار AgNO₃ درEG ، آرام آرام به ظرف واکنش تزریق گردید. نسبت درصد وزنی PVP به AgNO₃ ، ۵/۷ انتخاب شد. پس از تزریق محلول AgNO₃ ، واکنش به مدت ۳۰ دقیقه تحت همان شرایط قرار گرفت. بعد از اتمام واکنش، برای جداسازی PVP از سطح محصولات تهیه شده و همچنین حذف ناخالصیها، محلول نهایی یک بار با استون و دو بار با اتانول شست و شو داده شد و سپس در سرعت چرخش ۳۰۰۰ دور بر دقیقه به مدت ۲۰ دقیقه سانتریفیوژ گردید. محصول نهایی در اتانول نگه داری شد. این نمونه Ag-SL نامگذاری شد. برای تهیه نمونه در حضور دانه NaCl ، بعد از تهیه محلول پلیمر PVP در EG ، مقدار NaCl · نمک NaCl به عنوان دانه به ظرف واکنش اضافه شد، سپس دمای محلول به دمای ۱۷۰ درجه سانتیگراد رسید. بقیه فرایند مشابه با آزمایش قبل انجام شد. این نمونهی سنتزی، Ag-S-7.5 نامگذاری شد .

AgNO3 به PVP اثر نسبت درصد وزنی پلیمر PVP به

به منظور بررسی اثر غلظت پلیمر PVP بر رشد AgNW از دو نسبت وزنی PVP به AgNO₃ استفاده شد. در این آزمایشها از نمک NaCl بعنوان دانه استفاده گردید و نسبت PVP به AgNO₃ از ۵/۷ به ۳/۵ در دو فرایند سنتز مجزا کاهش داده شد. تمام مراحل سنتز مشابه با آنچه که در بخش قبلی توصیف گردید صورت پذیرفت. برای دستیابی به نسبت PVP به AgNO₃ برابر با ۳/۵، به ظرف واکنش ۲۳۳٬۰۰ گرم از پلیمرPVP اضافه شد. نمونههای سنتز شده براساس نسبت وزنی PVP به AgNO₃ بکار گرفته شده در فرایند سنتز، به ترتیب AgN5.5-2.5 و 5.5-2.5 نامگذاری شدند. در جدول ۱، تمامی نمونههای سنتز شده در این کار معرفی شدهاند.

سرعت چرخش محلول(rpm)	دما (C ⁰)	دانه	نسبت PVP/AgNO ₃	نام نمونه
1	١٧٠	-	V/Δ	Ag-SL
1	14.	NaCl	V/Δ	Ag-S-7.5
1	14.	NaCl	٣/۵	Ag-S-3.5

جدول ۱. معرفی نمونههای سنتز شده

AgNW طراحي الكترود منعطف بر پايه

به منظور بررسی اثر مورفولوژی نانوسیمهای نقره بر خواص اپتیکی و الکتریکی آنها، الکترودهای منعطف بر پایه cm² معید گردیدند و مورد مشخصه یابی قرار گرفتند. برای تهیه الکترودها درابتدا صفحاتPET با ابعاد cm² × 7 و ضخامت mm ۲×۲ و ضخامت mm ۵/۱۷ توسط شوینده، آب مقطر و اتانول در دمای اتاق شستشو داده شدند. بعد ازهر مرحله از شستشو، مفحات PET و ضخامت mm ۲×۲ و صفحات ۳ معام فراصوت قرار داده شدند و در دمای ۲۰ تاق شستشو داده شدند. بعد ازهر مرحله از شستشو، مفحات PET به مدت ۳ دقیقه درون حمام فراصوت قرار داده شدند و در دمای ۲۰ درون آون به طور کامل خشک شدند. از مود و نمونه ی.5.7.5 م.3 محلولهای پایه اتانولی با غلظت mg/ml ۴ تهیه شد. برای لایه نشانی یکنواخت AgNW هر دو نمونه ی.5.7.5 ماه درون حمام فراصوت قرار داده شدند و در دمای ۲۰ درون آون به طور کامل خشک شدند. از مود و نمونه ی.5.7 ماه درون حمام فراصوت قرار داده شدند و در دمای ۲۰ مای ۲۰ درون آون به طور کامل خشک شدند. از مر دو نمونه ی.5.7 ماه مدت ۳ دقیقه درون حمام فراصوت قرار داده شدند و در دمای ۲۰ مرون آون به طور کامل خشک شدند. از مود و نمونه ی.5.7 ماه مدون حمام فراصوت قرار داده شدند و در دمای ۲۰ می درون آون به طور کامل خشک شدند. از مود دو نمونه ی.5.7 ماه در مای معال محمد معان با غلظت اسی به سران می میکرولیتر) از محلول های بر روی صفحه این از دستگاه لایه نشان چرخشی استفاده شد. بدین منظور حجم مشخصی (۱۰۰ میکرولیتر) از محلول های نانوسیم نقره تهیه شده در حالت دینامیک بر روی صفحه PET قرار داده شد و با چرخش صفحه با سرعت ۳۰۰ ۲۰۰۳ لایه نشانی انجام پذیرفت. به منظور بررسی اثر ضخامت لایه نانوسیم نقره بر مقاومت سطحی و شفافیت الکترودهای حاصل، حجم محلول نانوسیم لایه نشانی از µ1 ۱۰۰ به مقادیر بالاتر افزایش داده شد. صفحات PET لایه نشانی شده در آون در دمای ℃ ۱۴۰ به مدت ۳۰ دقیقه قرار گرفتند و سپس در خلا برای مطالعات بعدی نگهداری شدند.

۲-۴- مشخصه یابی مواد سنتز شده و الکترودهای منعطف

FT-IR-1-4-1- طيف سنجي مادون قرمز

از دستگاه طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه BRUKER مدل آلفا برای تایید حذف پلیمر PVP از سطح AgNW در مرحله خالص سازی محصول نانوسیمهای نقره استفاده شد. به این منظور، بعد از شستشوی نمونهها با استون و اتانول و سانتریفیوژ نمودن نمونهها، یک قطره از محلول فوقانی (اتانول) برروی قرص KBr ریخته شد و سپس طیف آن برای بررسی وجود PVP وEG حذف شده بررسی گردید. همچنین از AgNW لایه نشانی شده بر روی بستر منعطف PET ،طیف مادون قرمز نمونه به روش ATR گرفته شد .

UV-Vis) مرئى (UV-Vis) - 4-4-4 مرئى

از دستگاه طیف سنجی فرابنفش – مرئی Perkin-Elmer (UV-Vis) مدل Lambda 45 برای بررسی اثر حضور NaCl و تایید سنتز AgNW استفاده گردید. بدین منظور μ ۵۰ ازمحلول اتانولی نمونههای Ag-SL و Ag-SL و Ag-SL با غلظت mg/ml درون سل ۳ سنتز MgNu استفاده گردید. بدین منظور μ ۵۰ ازمحلول اتانولی نمونههای Ag-SL و Ag-SL و Ag-SL و Ag-V۵۰ و درون سل ۳ استز کروی اتانول ریخته شد و همگن گردید و بعد از قرار گرفتن درون دستگاه، در گستره طول موج ۷۵۰–۲۵۰ نانومتر مورد ارزیابی قرار گرفتند. میزان عبوردهی الکترودهای طراحی شده بر پایه نانوسیم نقره نیز با قرار دادن مستقیم الکترودها در درون ارزیابی قرار گرفتند. میزان عبوردهی الکترودهای طراحی شده بر پایه نانوسیم نقره نیز با قرار دادن مستقیم الکترودها در درون دستگاه در ارزیابی قرار گرفتند. میزان عبوردهی الکترودهای طراحی شده بر پایه نانوسیم نقره نیز با قرار دادن مستقیم الکترودها در درون دستگاه در این آزمایش ها، الکترودهای طراحی شده بر پایه نانوسیم نقره نیز با قرار دادن مستقیم الکترودها در درون دستگاه در محل نمونه در این این آزمایش ها، الکترودهای طراحی شده بر پایه نانوسیم نقره نیز با قرار دادن مستقیم الکترودها در درون دستگاه در این این آزمایش ها، الکترودهای طراحی شده بر روی یک پایه یونولیتی، در محل نمونه در دستگاه در این این آزمایش ها، الکترودهای طراحی شده بر روی یک پایه یونولیتی، در محل نمونه در دستگاه دادن در طول موج ۵۵۰ ماه در در ماری (شفافیت) مورد ارزیابی قرار گرفت. طول موج ۵۵۰ ۵۵۰ درصد عبور نور مرئی (شفافیت) مورد ارزیابی قرار گرفت. طول موج ۵۵۰ ۵۵۰ در مان مانور در ناحیه مرئی میباشد.

SEM) میکروسکوپ الکترونی روبشی

به منظور بررسی مورفولوژی و تعیین قطر و طول AgNW سنتز شده، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مدل ALS2300C استفاده شد. بدین منظور، مقدارمشخصی از محلول پایه اتانولی AgNW برروی سطح شیشه ای کاملا تمیز و عاری از آلودگی با استفاده از روش لایه نشانی چرخشی لایه نشانی شد و نمونهها بعد از انجام اسپاترینگ لایه بسیار نازکی از طلا مورد تصویر برداری قرار گرفتند.

۲-۴-۴ اندازه گیری مقاومت سطحی الکترودهای منعطف

برای بررسی مقاومت سطحی الکترودهای تهیه شده بر پایهی نانوسیمهای نقره از مقاومت سنج استفاده شد. برای این منظور مقاومت سطحی نمونهها در ۴ نقطه که هر دو نقطه به فاصله ۱ سانتیمتر مربع از یکدیگر قرار دارند، اندازه گیری می شود. اندازه گیری مقاومت سطحی الکترودها، بعد از عملیات حرارت دهی در دمای ℃۱۴۰ به مدت ۳۰ دقیقه مورد بررسی قرار گرفت.

۳-بحث و نتیجه گیری

۳-۱-طيف سنجي مادون قرمز (FT-IR)

برای تهیه AgNWهای خالص، بعد از اتمام واکنش ناخالصیهای فرایند واکنش مانند حلال، نانوذرات نقره، پلیمر PVP قرار گرفته برروی سطوح AgNWها، با کمک سانتریفیوژ جدا شده و سپس با استفاده از استون و اتانول، شست و شو داده شد و خالص سازی نانوسیمها صورت گرفته است. از آنالیز FT-IR به منظور تایید حذف ناخالصیها در طی فرایند شستشوی AgNW با استون و اتانول استفاده شد. برهمکنش الکترواستاتیک استون و اتانول با PVP، سبب جداسازی این پلیمر از سطح AgNW و همچنین باعث حذف ناخالصیهای دیگر از AgNW می گردد. شکل ۱ طیف –IR (الف) محلول اتانولی قرار گرفته بر روی رسوب پس از سانتریفیوژ و (ب) AgNW لایه نشانی شده بر روی بستر منعطف IPT را نشان میدهد. در طیف (الف) پیک جذبی پهن در ¹⁻ ۳۳۸۴/۶cm ارتعاشات کششی OH را نشان میدهد که مربوط به حضور گروههای هیدروکسیل آب تولید شده، طبق واکنش شماره ۱ میباشد. در دمای بالا، اتیلن گلایکول به استآلدهید تبدیل میشود که سبب کاهش یونهای نقره به نقره فلزی می گردد (واکنش شماره ۲). آب به عنوان محصول جانبی در طی واکنش تشکیل میشود.

2HO-CH ₂ -CH ₂ -OH →	$2CH_3CHO + 2H_2O$	واکنش شماره (۱)
$2Ag^+ + 2CH_3CHO \longrightarrow$	$2Ag + CH_3$ -CO-CO-CH $_3 + 2H^+$	واكنش شماره (۲)



شکل ۱- طیف IR- (الف) محلول اتانولی قرار گرفته بر روی رسوب پس از فرایند سانتریفیوژ و (ب) AgNWها لایه نشانی شده بر روی بستر منعطف

UV-Vis) مرئى (UV-Vis) - ۲-۳

به منظور تایید سنتز AgNW و همچنین بررسی اثرحضور NaCl در فرایند سنتز AgNW، از طیف سنجی AgNV استفاده شد. شکل ۲ طیف SL و Ag-SL و Ag-SL و Ag-SL را نشان می دهد. برای نمونه Ag-SL پیک جذبی در nm استفاده شد. شکل ۲ طیف SL نمونه UV-Vis و Ag-SL و Ag-SL را نشان می دهد. برای نمونه Ag-SL پیک جذبی در nm نمونه 425 ظاهر شده است که مربوط به تشکیل نانوذرات نقره می باشد که نشان می دهد در غیاب دانه NaCl، Wacl تشکیل نائد. برای نمونه رو به تشکیل نانوذرات نقره می باشد که نشان می دهد. برای نمونه Ag-SL پیک جذبی در nm با مده شد. شکل ۲ طیف Ag-SL مربوط به تشکیل نانوذرات نقره می باشد که نشان می دهد در غیاب دانه Ag-N مربوط به تشکیل نانوذرات نقره می باشد که نشان می دهد در غیاب دانه Ag-SL بیک جذبی در nm با مده است که مربوط به تشکیل نانوذرات نقره می باشد که نشان می دهد در غیاب دانه Ag-SL بیک مربوط به تشکیل به ترتیب مربوط به حالت رزونانس دوقطبی و چهارقطبی خارج از صفحه Ag-SP ها می باشند.



شكل۲- طيف UV-Vis نمونه هاى نانوذرات نقره Ag-SL، نانوسيم نقره UV-Vis

۳-۳- بررسی مورفولوژی نانوسیمهای نقره با استفاده از SEM

برای بررسی مورفولوژی محصولات و تعیین نسبت ابعاد AgNW ها از SEM استفاده شد. شکل ۳ تصاویر SEM نمونههای Ag-SL و Ag-S-- Ag-SL را نشان میدهد که به ترتیب در عدم حضور و در حضور نمک NaCl بعنوان دانه سنتز شدهاند. همانطوریکه دیده میشود، در عدم حضور نمک سدیم کلراید فقط نانوذرات نقره تشکیل شدهاند و هیچ نانوسیم نقره ای حاصل نشده است. اما تصویر SEM نمونه Ag-S-5.5 نشان میدهد که نمک سدیم کلراید نقش مؤثری در تشکیل Macl داشته به گونه ای که فقط مقدار جزئی نانوذرات نقره تشکیل شدهاند.

کاتیون سدیم سبب جذب اکسیژنهای حل شده در واکنش و همچنین اکسیژنهای اتمی از سطح نقره می گردد. در حضور اکسیژن ، اچینگ اکسیداسیونی رخ می دهد. به این شکل که درصورت وجود اچ کننده در محلول، MTPها اکسید شده و اتمهای نقره به درون محلول آزاد می گردند. آنیون کلرید علاوه بر ایجاد یک پایداری الکتروستاتیکی برای هستههای نقره اولیه، از طریق تشکیل رسوب AgCl، سبب کاهش سرعت ورود یونهای نقره آزاد در محیط واکنش می گردد. انحلال پذیری رسوب AgCl در دمای بالا، سبب ورود یونهای نقره با سرعت کم تر در محیط واکنش می شود که این امر برای تشکیل AgClها با بازده بالا مطلوب می باشد [۵۶].



شکل۳- تصاویر SEM نمونههای (الف) Ag-SL و (ب) SEM

همانطوریکه در واکنشهای شماره ۱ و ۲ نمایش داده شد، مکانیزم سنتز AgNW به این صورت است که در ابتدا در دمای بالا EGبه استآلدهید تبدیل می شود و با ورود یونهای نقره، نانوذرات نقره توسط استآلدهید تشکیل می گردند. در ادامه ی فرایند طبق مکانیسم اسوالد (شکل ۴) بعضی از نانوذرات نقره کوچک تر حل شده و یونهای نقره حاصل به نانوذرات بزرگ تر اضافه می گردند و به این ترتیب نانوذرات بزرگتر نقره به طور مداوم رشد می کنند [۵۷].



شکل ۴- طرح شماتیکی از مکانیسم اسوالد مبنی بر تشکیل ذرات بزرگتر از ذرات کوچکتر نقره [۵۷]

با پیشرفت فرآیند، از میان ساختارهای نقره تشکیل شده، MTPهای با سطح مقطع پنج ضلعی به صورت نانوسیم شروع به رشد می کنند. سینتیک واکنش فاکتور کلیدی برای تشکیل MTP ها می باشد. در حضور دانه NaCl ، تشکیل رسوب نقره کلرید باعث کاهش غلظت یون نقره آزاد می گردد و به این ترتیب در دمای بالا انحلال پذیری کم رسوب نقره کلرید سبب آزاد شدن یون های نقره با سرعت کندتری در محیط واکنش می شود که این فرایند برای تشکیل MTP ها مساعد می باشد. اما، در عدم یون ما مرعت کندتری در محیط واکنش می شود که این فرایند برای تشکیل MTP ها مساعد می باشد. اما، در عدم حضور دانه NaCl اسرعت کندتری در محیط واکنش می شود که این فرایند برای تشکیل MTP ها مساعد می باشد. اما، در عدم حضور دانه NaCl ، یونهای نقره با سرعت کندتری در محیط واکنش می شود که این فرایند برای تشکیل MTP ها مساعد می باشد. اما، در عدم حضور دانه NaCl می دونهای نقره با سرعت کندتری در محیط واکنش می شود که این فرایند برای تشکیل MTP ها مساعد می باشد. اما، در عدم مضور دانه NaCl می دونهای نقره با سرعت کندتری در محیط واکنش می شود که این فرایند برای تشکیل MTP ها مساعد می باشد. اما، در عدم مضور دانه NaCl می دونه در در ادامه و انانوزرات را تشکیل می دهند. شکل ۵، طرح شماتیک رشد M2N ها را در حضور NaCl بعنوان دانه نشان می دهد. در ادامه و اکنش پلیمر PVP به عنوان عامل پوشاننده مماتیک رشد MTP سبب کنترل ابعاد Macl می گردند. پلیمر PVP برهم کنش بیشتری با برخی از وجوه MTP ها دارد، به این ترتیب که وجوه (۱۰۰) MTP ها توسط اتم های اکسیژن پیرولیدون پایدار می گردند و وجوه (۱۰۱) آن برای رشد ناهمسانگرد فعال باقی می مانند. با اضافه شدن یونهای نقره در ادامه ی فرایند، MTPها به صورت نانوسیم رشد می کنند. رنگ خاکستری معصول تشکیل M2N را نشان می دهد.

از لحاظ ترمودینامیکی، جذب اتمهای اکسیژن حلقهی پیرولیدون بر روی سطح کریستال، سبب کاهش انرژیهای آزاد سطح کریستال و پایداری آن میگردد. برهم کنش بیشتر پلیمر PVP با برخی از وجههای کریستالها و اضافه شدن اتمهای فلزی به وجههایی که پوشانده نشدند؛ سبب کنترل شکل نانوکریستال میگردد [۴۸-۴۶].



شکل۵- طرح شماتیکی ازمکانیزم رشد AgNWها در حضور دانه و پلیمر PVP

شکل۶ تصایر SEM نمونههای SEG. و Ag-S-3.5 و Ag-S-3.5 را نشان میدهد که در حضور نمک NaCl و با استفاده از دو نسبت مولی ۷/۵ و ۳/۵ از پلیمر PVPبه AgNO₃ سنتز شدهاند. همان طوریکه دیده میشود، نسبت ابعاد و مورفولوژی نهایی AgNW ها در فرایند پلی اُل به شدت وابسته به نسبت مولی PVP/AgNO₃ میباشد. با تغییر این نسبت، قطر و طول MgAها تحت تاثیر قرار گرفته است. به طور میانگین قطر و طول MAgNAها در نمونه ی Ag-S-7.5 به ترتیب ۹۰۸۳ و سل ۵ تعیین شد. اما برای نمونه ی Ag-S-3.5 که از نسبت کوچکتری از پلیمر PVP به AgNO₃ استفاده شد؛ قطر نانوسیمها به ۲۰۰۳ کاهش و طول آنها به 7 سافزایش یافت. در نمونه ی Ag-S-7.5 به علت وجود مقدار بیشتری از PVP در محیط واکنش، انتظار می رود که این پلیمر علاوه بر وجوه (۱۰۰) با وجوه (۱۱۱) نیز برهم کنش داده و سطح نقره را بپوشاند. به این ترتیب، اضافه شدن یونهای نقره در دو جهت قطر و طول، منجر به رشد همسانگرد نانوسیمها میگردد؛ به همین علت، Mg-Ag ها با قطر بیشتر و طول کم تر تشکیل شدهاند.



شكل ج- تصاوير SEM نمونه هاى (الف) Ag-S-7.5 و (ب) م

شکل ۷ طرح شماتیکی از اثر نسبت پلیمر PVPبه AgNO₃ را نشان میدهد. افزایش نسبت پلیمر PVP به AgNO₃ ، منجر به رشد همسانگرد نانوسیمها می گردد و در نهایت نانوسیمهای با قطر بیشتر و طول کمتر بدست می آیند. با کاهش این نسبت، با توجه به اثر PVP، AgNWها با نسبت طول به قطر بیشتری تهیه می گردد. بنابراین با تغییر نسبت عامل پوشانندهی پلیمری به پیش ماده نیترات نقره می توان AgNWها با نسبت ابعاد مختلف را سنتز کرد.



شکل ۷- طرح شماتیکی از اثر نسبت پلیمر PVP به AgNO₃

۳-۴- بررسی ویژگیهای الکتریکی و نوری الکترودهای رسانای شفاف

الکترودهای منعطف تهیه شده برپایه ی AgNW از نمونههای Ag-S-3.5 و Ag-S-3-5 مورد بررسی نوری و الکتریکی قرارگرفتند. از آنجا که در طراحی الکترودها مخصوصا آند در سلولهای خورشیدی، برای بالابردن راندمان سلول خورشیدی، میزان شفافیت بالاتر به منظور افزایش عبور نور بیشتر و مقاومت سطحی کمتر به منظور افزایش انتقالات الکترونی بهتر، مطلوب میباشد، در الکترودهای تهیه شده این دو فاکتور می بایست بهینه گردد. در شکل ۸ تصویر دیجیتالی الکترودهای منعطف طراحی شده بر پایه نمونه Ag-S-7.5 که دارای ضخامت متفاوت از لایه نانوسیم نقره میباشند، نمایش داده شده است. همانطوریکه دیده میشود الکترودها دارای ظاهری شیری رنگ هستند و با افزایش حجم محلول نانوسیم نقره لایه نشانی شده



شکل۸- تصویر دیجیتالی الکترودهای تهیه شده بر پایه ی Ag-S-7.5 با لایه نشانی حجمهای (الف) ۱۰۰، (ب) ۲۰۰، (ج) ۳۰۰ و (د) ۴۰۰ میکرولیتر

در جدول ۲ دادههای مربوط به تغییرات مقاومت سطحی و درصد عبور نور این الکترودها گزارش شده است. همانطوریکه دیده میشود با افزایش حجم نمونه لایه نشانی شده از ۱۰۰μ۱ به ۲۰۰۹، درصد عبور نور مرئی (شفافیت) و مقاومت سطحی الکترودها به شدت کاهش یافت. از آنجا که در حجم μ ۴۰۰ شفافیت الکترود به زیر ۱۰٪ عبور رسید تهیه ی الکترود از نمونه موجه متوقف گردید. از میان الکترودهای طراحی شده از نمونهی Ag-S-7.5، الکترود با حجم μ ۲۰۰ با درصد عبور نور ۳۴/۳۹ و مقاومت سطحی ۱۲۴/۲ Ω/cm² بهترین الکترود به عنوان آند انتخاب شد.

مقاومت سطحی(Ω/cm²)	درصد عبور (T./)	حجم نمونه (μl)
-	۵۶/۶	1
174/7	۳ <i>۴</i> /۳۹	۲
۵۶/۳	10/51	۳
۲۸/۶	٩/٠ ١	۴

جدول ۲. مقادیر محاسبه شده درصد عبور و مقاومت سطحی الکترودهای تهیه شده بر پایه ی Ag-S-7.5

Ag-S-7.5 شکل ۹ نمودار تغییرات درصد عبور نور و مقاومت سطحی الکترودها بر حسب حجم لایه نشانی شده از نمونه AgNW و را نشان میدهد. با افزایش حجم محلول وارد شده بر روی سطح بستر، به دلیل قرارگرفتن دانسیته ی بالاتری از AgNW و افزایش تراکم برروی سطح، درصد عبور نورکاهش یافته است. در مقابل، به دلیل افزایش اتصالات بیشتر AgNW برای انتقال الکترون، مقاومت سطحی نمونه کاهش چشمگیری را نشان میدهد.



شکل۹- تغییرات شفافیت و مقاومت سطحی الکترودهای طراحی شده بر پایه ی نمونه ی Ag-S-7.5 برحسب حجم نمونه ی لایه نشانی شده

در شکل ۱۰ تصویر دیجیتالی الکترودهای منعطف طراحی شده بر پایه نمونه ی Ag-S-3.5 که دارای ضخامت متفاوت از لایه نانوسیم نقره میباشند، نمایش داده شده است. همانطوریکه دیده میشود، این الکترودها به طور کلی دارای ظاهری شفاف تر نسبت به الکترودهای تهیه شده بر پایه ی نمونه ی Ag-S-7.5 هستند. برای این الکترودها حجم نمونه از ۱۰۰ تا ۲۰۰۴ به منظور افزایش ضخامت لایه ی الکترودی و بررسی تاثیر آن بر روی مقاومت سطحی و شفافیت الکترودها افزایش داده شد.



شکل ۱۰- تصویر دیجیتالی الکترودهای تهیه شده بر پایه یAg-S-3.5 با لایه نشانی حجمهای (الف) ۱۰۰، (ب) ۲۰۰، (ج) ۳۰۰، (د) ۴۰۰، (و) ۶۰۰ شکل ۱۰- تصویر دیجیتالی الکترودهای تهیه شده بر پایه ی ۸۰۰ و (ی) ۲۰۰ میکرولیتر

در جدول ۳، دادههای مربوط به تغییرات مقاومت سطحی و درصد عبور نور برای حجمهای مختلف از نمونه یAg-S-3.5 در جدول ۳، دادههای مربوط به تغییرات مقاومت سطحی و درصد عبور نور برای مقاومت سطحی الکترودها نشان نداد به گزارش شده است. از آنجایی که تا حجم العرب ۴۰۰۹ دستگاه مقاومت سنج عددی را برای مقاومت سطحی الکترودها نشان نداد به همین دلیل حجمهای بالاتری از محلول Ag-S-3.5 برروی بستر PET لایه نشانی شدند. با افزایش حجم درصد عبور نور کاهش همین دلیل حجمهای بالاتری از محلول Ag-S-3.5 برروی بستر PET لایه نشانی شدند. با افزایش حجم درصد عبور نور کاهش پیدا کرده و درمقابل مقاومت سطحی الکترودها به علت افزایش تراکم AgNWها برروی سطح و افزایش اتصالات کرم بین سیمها، کاهش پیدا کرد.

مقاومت سطحی (Ω/cm²)	درصد عبور (T./)	حجم نمونه (μl)
	አ ٩/ነ <i>۶</i>	١
	Va/TT	۲۰۰
	۶ ९/९۲	۳۰۰
	۵۷/۳۴	4
۷۵/۲	44/41	۶
F9/8	٣٠/٢٩	٨٠٠
22/9	١/۵٣	17

جدول ۳. مقادیر محاسبه شده درصد عبور و مقاومت سطحی الکترودهای تهیه شده بر پایه یAg-S-3.5 م

نمودار تغییرات درصد عبور نور و مقاومت سطحی الکترودها بر حسب حجم لایه نشانی شده از نمونهی Ag-S-3.5 در شکل ۱۱ نمایش داده شده است. هرچند نمونه ی Ag-S-3.5 با حجمهای ۸۰۰ و ۱۲۰۰ میکرولیتر مقاومت سطحی بسیار پایینی را نشان میدهند اما به دلیل تراکم بیشتر نانوسیمها برروی سطح بستر، درصد عبور نور بسیار کاهش پیدا کرده است. با توجه به اینکه الکترود تهیه شده با حجم γο/۲ از نمونه دارای شفافیت ۴۴/۴۷ ٪ ومقاومت سطحی ² میباشد؛ می تواند بعنوان گزینه ی مطلوبی برای آند در ساختار سلولهای خورشیدی در نظر گرفته شود.



شکل۱۱- تغییرات شفافیت و مقاومت سطحی الکترودهای طراحی شده بر پایه ی نمونه یAg-S-3.5 بر حسب حجم نمونه ی لایه نشانی شده

همانطوریکه دیده شد، الکترودهای تهیه شده بر پایهی نمونهی Ag-S-3.5 با ضخامت برابر دارای شفافیت بیشتر و مقاومت سطحی کمتری نسبت به الکترودهای تهیه شده بر پایهی نمونهی Ag-S-7.5 بودند. این نتایج تاثیر ویژهی مورفولوژی و نسبت ابعادی نانو سیمهای نقره را بر خواص الکتریکی و نوری آنها نشان میدهد. در نمونهی Ag-S-3.5 هر MgAal با طول بیشتر و قطر کمتر، شفافیت بالاتری در غلظت برابر نشان دادند. به منظور طراحی الکترود رسانای شفاف به عنوان آند در سلولهای خورشیدی پلیمری، مقدار مقاومت سطحی و درصد عبور نور باید بهینه گردد. بدین ترتیب بهترین الکترود طراحی شده می بایست دارای مقاومت سطحی کم تر و عبور دهی نور بالاتری نسبت به نور مرئی باشد. دربین الکترودهای طراحی شده از نمونههای Ag-S-3.5 با حجم Ag-S-3.5 با حجم Ag-S-3.5 با حجم Ag-S-3.5 با حجم γ۵/۲۹ درصد عبور و مقاومت سطحی کم تر و عبور دهی نور بالاتری نسبت به نور مرئی باشد. دربین الکترودهای طراحی شده از نمونههای Ag-S-3.5 بهترین الکترود به عنوان آند از نمونه ی Ag-S-3.5 با حجم Ag-S-3 با کرد.

٤-نتيجه گيري

هدف از مقاله حاضر، سنتز نانوسیم های نقره برای کاربرد بعنوان الکترود در سلول های خورشیدی پلیمری می باشد، بررسی پارامترهای سنتز با ویژگی های ساختاری و عملکردی، کنترل ضخامت نقره بر زیرلایه منعطف، ارتباط مستقیم ساختار نانوسیم های نقره با روش سنتز، تاثیر روش سنتز بر خواص نوری (شفافیت الکترود ساخته شده) و الکتریکی (بررسی مقاومت و هدایت الکتریکی الکترود طراحی شده)، از اهداف اصلی مقاله بوده است. در این مقاله، MagNal به روش پلی آل در حضور دانه سدیم کلراید تهیه شدند. اثر حضور دانهی سدیم کلراید به عنوان عامل کنترل کننده سینتیک واکنش در جهت تشکیل نانوسیمهای نقره، توسط نتایج حاصل از طیف سنجی SUV-Vis و تصاویر SEM تایید شد. سپس اثر کاهش نسبت پلیمر به یون نقره کمتر میباشد؛ به علت برهمکنش بیشتر مولکولهای UV-Vis و تصاویر MSP تایید شد. سپس اثر کاهش نسبت به یون نقره کمتر میباشد؛ به علت برهمکنش بیشتر مولکولهای PVP با وجوه (۱۰۰) نقره، نانوسیمهای طویل بر با ضخامت روی بستر منعطف PTP لایه نشانی گردید و الکترودهایی با ضخامت متفاوت تهیه شد. با افزایش حجم محلول لایه نشانی چرخشی بر و قرار گرفتن تعداد بیشتری از نانوسیمهای نقره بر روی سطح، درصد عبور نور و مقاومت سطحی الکترود حاصل کاهش می یابد. درصد عبور نور و مقاومت سطحی تمامی الکترودهایی با ضخامت متفاوت تهیه شد. با افزایش حجم محلول لایه نشانی چرخشی بر و قرار گرفتن تعداد بیشتری از نانوسیمهای نقره بر روی سطح، درصد عبور نور و مقاومت سطحی الکترود حاصل کاهش می-یابد. درصد عبور نور و مقاومت سطحی تمامی الکترودها با تغییر حجم محلول لایه نشانی شده برسی گردید و مشخص شد که عواص نوری و الکتریکی AgNW به شدت وابسته به نسبت ابعادی آنها میباشد.

٥- تقدير و تشكر

از همکاری آزمایشگاههای نانوشیمی و انرژیهای نو در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنین از ستاد نانو به دلیل حمایت مالی این پروژه، تشکر و قدردانی می گردد.

٦-مراجع

[1] N. D. Damgaard, C. Cruickshank, S. Foged, J. Thorsen, and F. C. Krebs, *Sol. Energ. Mat. Sol. C.*, 94 (2010) 1553–1571.

[2] M Saeidi, A Mozaffari, S Rahimnejad, R Rahmanian, J. Applied chemistry (ISC), 8 (28) (2013) 79-90.

[3] F. C. Krebs, Sol. Energ. Mat. Sol. C., 93 (2009) 394-412.

[4] G. Li, R. Zhu, and Y. Yang, Nat. Photonics., 6 (2012) 153-161.

- [5] YY. Choi, SJ. Kang, HK. Kim, WM. Choi, SI. Na, Sol. Energ. Mat. Sol. C., 96 (2012) 281-285.
- [6] DS. Ginley, Handbook of Transparent Conductors, Springer, (2010).

[7] Z. Chen, K. Yang, J. Wang, Thin Solid Films, 162 (1988) 305-313.

[8] Y.S. Kim, Y.C. Park, S.G. Ansari, B.S. Lee, H.S. Shin, Thin Solid Films, 426 (2003) 124-131.

- [9] Y. Gao, G. Zhao, Z. Duan, Y. Ren, Mat. Sci.-Poland, 32 (1) (2014) 66-70.
- [10] Y. Han, D. Kim, J.S. Cho, S.K. Koh, Y.S. Song, Sol. Energ. Mat. Sol. C., 65 (1-4) (2001) 211–218.

[11] A.R. Madari., A. Kumar, F.N. Ishikawa, C. Zhou, Nano Res., 3 (2010) 564–573.

[12] M. Manceau, D. Angmo, M. Jorgensen, F.C. Krebs, Org. Electronics, 12 (4) (2011) 566-574.

[13] H. Park, P.R. Brown, V. Bulovic, J. Kong, Nano Lett., 12 (1) (2011) 133-140.

[14] Y. Galagan, J.M. Rubingh, R. Andriessen, C-C. Fan, P.W.M. Blom, S.C. Veenstra, and J. M. Kroon, Sol. Energ. Mat. Sol. C., 95 (5) (2011) 1339-1343.

[15] D. Angmo, F. C. Krebs, Appl. Poly. Sci., 129 (1) (2013) 1-14.

[16] A. Gadisa, K. Tvingstedt, S. Admassie, L. Lindell, X. Crispin, M.R. Andersson, W.R. Salaneck, and O. Ingan, *Synth. Metals*, **156** (2006) 1102–1107.

[17] Krebs Frederik C., Winther-Jensen B., Sol. Energ. Mat. Sol. C., 90 (2006) 123–132.

[18] J.Snaith H., Kenrick H., Chiesa M., H.Friend R., Polym., 46 (8) (2005) 2573-2578.

[19] A.K. Geim, and K.S. Novoselov, Nature Mat., 6 (2007) 183-191.

[20] Z. Wu, Z. Chen, X. Du, J.M. Lgan, J. Sippel, M. Nikolou, K. Kamaras, J.R. Reynolds, D.B. Tanner, A.F. Hebard, and A.G. Rinzler, *Science*, **305** (2004) 1273–1276.

[21] C.F. Krebs, Sol. Energ. Mat. Sol. C., 93 (9) (2009) 1636-1641.

- [22] K. Myung-Gyu, G.L. Jay, Adv. Mat., 19 (2007) 1391–1396.
- [23] H.J. Lee, J.H. Hwang and K.B. Choi, ACS Appl. Mat. Interf., 5 (21) (2013) 10397-10403.
- [24] A. Mityashin, D. Cheyns, B.P. Rand and P. Heremans, *Appl. Phys. Lett.*, **100** (5) (2012) 0533051-0533057.
- [25] Y. Wu, J. Xiang, C. Yang, W. Lu, and C.M. Lieber, Nature, 430 (2004) 704-704.
- [26] M. Park, Y. Sohn, W. G. Shin, J. Lee and S.H. Ko, Ultrason. Sonochem., 22 (2015) 35-40.
- [27] J.I. Pascual, J. Mendez, J. Gomez-Herrero, A.M. Baro, N. Garcia, U. Landman, W.D. Luedtke,
- E.N. Bogachek and H.P. Cheng, Science, 267 (1995) 1793-1795.
- [28] A Daneshfar, R Sahrai, J. Applied chemistry (ISC), 7 (23) (2012) 35-41.
- [29] J.Y. Lee, S.T. Connor, Y. Cui and P. Peumans, Nano Lett., 8 (2008) 689-692.
- [30] L. Hu, H.S. Kim, J.Y. Lee, P. Peumans and Y. Cui, ACS, 4 (2010) 2955-2963.
- [31] G. Schider, J.R. Krenn, A. Hohenau, H. Ditlbacher, A. Leitner, R.F. Aussenegg, W.L. Schaich, I. Puscasu, B. Monacelli, and G. Boreman, *Phys. Rev. B*, **68** (2003) 155427.
- [32] S. Schafer, A. Petersen and TA. Wagner, Phys. Rev. B, 83 (16) (2011) 165311.
- [33] T. Kang, W. Choi, I. Yoon, H. Lee, M.K. Seo, Q.H. Park and B. Kim, *Nano Lett.* **12** (2012) 2331-2336.
- [34] G. Zhu, and D. Chen, J Mater Sci: Mater Electron, 23 (2012) 2035–2041.
- [35] Z. Yang, H. Qian, H. Chen and J. N. Anker, J. Colloid Interf. Sci., 352 (2010) 285-291.
- [36] B. Wiley, Y. Sun and Y. Xia, *Langmuir*, **21** (18) (2005) 8077–8080.
- [37] F. Fievet, J.P. Lagier, B. Blin, B. Beaudoin and M. Figlarz, Solid State Ionics, 32 (1989) 198-205.
- [38] Y. Xia, Y. Xiong, B. Lim and S.E. Skrabalak, Ange. Chemie Int. Ed., 48 (2009) 60-103.
- [39] C. Jia, P. Yang and A. Zhang, Mat. Chem. Phys., 143(2) (2014) 794-800.
- [38] M.R. Johan, N.A.K. Aznan, S.T. Yee, I.H. Ho, S.W. Ooi, N.D. Singho and F. Aplop, J. of Nanomat., 7 (2014).
- [40] H. S. Lee, Y. W. Kim, J. E. Kim, S. W. Yoon, T. Y. Kim, J. S. Nohe, K. S. Suh, *Acta Mat.*, **83** (2015) 84–90.
- [41] Y. Sun and Y. Xia, Adv. Mat., 14 (2002) 833-837.
- [42] D. Chen, X. Qiao, X. Qui, J. Chen, R. Jiang., J. Mat. Sci.: Mat. Electronics, 22 (1) (2011) 6-13.
- [43] K. E. Korte, S. E. Skrabalak and Y. Xia, J. Mat. Chem., 18 (2008) 437-441.
- [44] Y. Sun, B. Mayers, T. Herricks and Y. Xia, Nano Lett., 3 (2003) 955-960.
- [45] https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinylpyrrolidone.
- [46] Y. Zhang and Y. J. Lu, Cryst. Growth Design, 8 (7) (2008) 2101-2107.

- [47] W. A. Al-Saidi, H. Feng and K. A. Fichthorn, Nano Lett, 12 (2012) 997-1001.
- [48] Y. Sun, B. Gates, B. Mayers and Y. Xia, Nano Lett., 2 (2002) 165-168.
- [49] C. Chen, L. Wang, G. Jiang, J. Zhou, X. Chen, H. Yu and Q. Yang, *Nanotech.*, **17** (2006) 3933-3938.
- [50] B. Wiley, T. Herricks, Y. G. Sun and Y. N. Xia, Nano Lett., 4 (2004) 1733-1739.
- [51] S. Coskun, B. Aksoy, and H. E. Unalan, Cryst. Growth, 11 (2011) 4963-4969.
- [52] C. Tang, W. Sun, J. Lu and W. Yan, J. Colloid Interf. Sci., 416 (2014) 86-94.
- [53] B. Wiley, Y. Sun and Y. Xia, Acc. Chem. Res, 40 (2007) 1067–1076.
- [54] S. Chang, K. Chen, Q. Hua, Y. Ma and W. Huang, J. Phys. Chem. C, 115 (2011) 79-86.
- [55] B. Wiley, T. Herricks, Y. Sun and Y. Xia, Nano Lett., 4 (9) (2004) 1733–1739.
- [56] J. J. Zhu, C. X. Kan, J. G. Wan, M. Han, G. H. Wang, J. Nanomat., 982547 (2011) 1-7.
- [57] P. W. Voorhees, J. Stat. Phys., 38 (1) (1985) 231-252.